

Технологии автоматической градуировки и поверки двухпараметровых вихретоковых толщиномеров диэлектрических покрытий

среда, 13 марта 2024 г. 15:34 (11 минут)

Для измерения толщины диэлектрического покрытия на немагнитном металлическом основании применяется амплитудный метод вихретокового вида неразрушающего контроля. На результаты измерений оказывают влияние мешающие параметры, в частности удельная электрическая проводимость основания. Для проведения измерения с учетом удельной электрической проводимости разработан метод двухпараметровой обработки сигналов амплитудно-фазового вихретокового преобразователя.

Секция

Основная секция

Научный руководитель

Основной автор: СЯСЬКО, Михаил Владимирович

Докладчик: СЯСЬКО, Михаил Владимирович

Классификация сессии: Основная секция. Устные доклады.